

제19회 테스트 학술대회 일정표

시간	장소	거문고A(3층)	거문고B(3층)	거문고C(3층)	가야금A(2층)	가야금B(2층)	대금(3층)
08:30~09:00		등 록					
09:00~11:10	09:00~10:00 (60분)	Tutorial 1 Introduction to Adaptive Test 정은주(TERADYNE) Chair : 조정호(코리아테크)	1-1 Memory Test (1) 김현진(단국대학교)	2-1 Reliability (1) 박진규(SK하이닉스)	3-1 Test Industry (1) 김병호(한양대학교)	4-1 ATE H/W & S/W (1) 전봉완(LG전자)	5-1 Poster (1) 이현빈(한밭대학교)
	10:00~10:10	휴 식					
	10:10~11:10 (60분)	Tutorial 2 Big Data and the Future of AI 서봉원(서울대학교) Chair : 김현진(단국대학교)	1-2 Memory Test (2) 안진호(호서대학교)	2-2 Reliability (2) 박성주(한양대학교)	3-2 Test Industry (2) 이중호(용인대학교)	4-2 ATE H/W & S/W (2) 윤홍일(연세대학교)	5-2 Poster (2) 이현빈(한밭대학교)
11:20~11:50	개 회 식 사회 : 이현빈(한밭대학교) / 개회사 : 이기화(SK하이닉스) / 감사패, 공로상, 우수논문 시상						
11:50~12:20	초 청 강 연 연사 : 송창록 (SK하이닉스) "Digital Disruption of Manufacturing"						
12:20~13:30		점 심					
13:30~16:00	13:30~14:30 (60분)	전시기업 소개 & 발표 이현빈(한밭대학교)	1-3 Memory Test (3) 이영규(LG전자)	2-3 Test Cost Efficiency (1) 고진수(TERADYNE)	3-3 Production Test 김영부(윌테크놀로지)	4-3 ATE H/W & S/W (3) 송동섭(삼성전자)	5-3 Memory Test & Repair (1) 정우식(SK하이닉스)
	14:30~14:40	휴 식					
	14:40~16:00 (80분)	0-4 Memory Test (5) 권민현(SK하이닉스)	1-4 Memory Test (4) 권혁(ADVANTEST)	2-4 Test Cost Efficiency (2) 전준우(LG전자)	3-4 3D-IC Test 이창원(엑시콘)	4-4 SoC Design & Test 홍승일(실리콘웍스)	5-4 Memory Test & Repair (2) 김지원(태성에스엔이)
16:00~16:10	휴 식						
16:10~17:20	패 널 토 의 사회 : 김현진(단국대학교) "빅데이터 기술의 테스트 산업 응용 현황과 미래"						
17:20~18:00	폐 회 식 폐회사 : 안진호(호서대학교)						